**Истомина, Наталья Леонидовна. Разработка и исследование методов контроля геометрических параметров субмикрометрового диапазона микроэлектронных структур на основе дифрактометрии : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.12.13 / Моск. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского.- Москва, 1995.- 15 с.: ил. РГБ ОД, 9 95-4/2627-8**